Searcn Notes					

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/567,780	AKITA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Nouven N. Hanh	2834	

			•
SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
310	52	11/24/2006	ни
310	54	11/24/2006	HN
310	58	11/24/2006	HN
310	64	11/24/2006	HN
undati	All	6/2/07	HN
Sands		•	•
	w	•	
-			

INTERFERENCE SEARCHED			
Subclass	Date	Examiner	
·			
	· · ·		

SEARCH (INCLUDING SEAI	NOTES RCH STRATEGY	n
	DATE	EXMR
	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	,	
	-	
•		
•		